

各支援業務及び共用設備等における利用料一覧

業務	共用設備等 (通称、型番等)	利用料（円）（消費税及び地方消費税を除く。）			試験単位等 (標準測定時間)
		（ ）内は、第6条第2項第2号ただし書の規定に基づく特別の事情がある場合の利用料を示す。			
		学術研究機関	中小企業	大企業	
技術相談		無料	1件あたり最初の2時間まで10,000円。相談時間を延長する場合は、延長2時間につき15,000円（技術相談は、原則として1日につき1回2時間までとする。）。なお、上記以外に作業費が発生する場合は、実費を別途請求する。		
技術代行	原子分解能多機能透過電子顕微鏡 [NEOARM] (JEM-ARM200F)	40,600 (81,200)	73,100 (121,800)	97,400 (162,400)	1検体 (4時間以内)
	200kV透過電子顕微鏡 [200kV-TEM] (※1) (JEM-2200FS)	23,400 (46,800)	42,100 (70,200)	56,200 (93,600)	1検体 (4時間以内)
	走査透過電子顕微鏡 [STEM] (HD-2700)	29,000 (58,000)	52,200 (87,000)	69,600 (116,000)	1検体 (4時間以内)
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 [FE-SEM] (SU9000)	19,700 (39,400)	35,500 (59,100)	47,300 (78,800)	1検体 (4時間以内)
	低真空分析走査電子顕微鏡 [SEM] (SU6600)	18,000 (36,000)	32,400 (54,000)	43,200 (72,000)	1検体 (4時間以内)
	多機能分析走査電子顕微鏡 [SEM] (IT800 (SHL))	25,300 (50,600)	45,500 (75,900)	60,700 (101,200)	1検体 (4時間以内)
	微小デバイス特性評価装置 [nanoEBAC] (NE4000)	31,700 (63,400)	57,100 (95,100)	76,100 (126,800)	1検体 (4時間以内)
	表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 [AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	21,800 (43,600)	39,200 (65,400)	52,300 (87,200)	1検体 (4時間以内)
	二重収束型質量分析計 [Sector-MS] (※2、※3) (JMS-700 MStation)	4,500 (9,000)	8,100 (13,500)	10,800 (18,000)	1検体 (1時間以内)
	LC/TOFMS飛行時間型質量分析計 [ESI-TOFMS] (※4) (JMS-T100LC AccuTOF)	4,500 (9,000)	8,100 (13,500)	10,800 (18,000)	1検体 (1時間以内)
	LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析計 (※4、※5) (AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	4,500 (9,000)	8,100 (13,500)	10,800 (18,000)	1検体 (1時間以内)
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 [MALDI-TOFMS] (autoflex II)	4,500 (9,000)	8,100 (13,500)	10,800 (18,000)	1検体 (1時間以内)
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化Spiral飛行時間型質量分析計 [MALDI-Spiral-TOFMS] (JMS-S3000)	4,500 (9,000)	8,100 (13,500)	10,800 (18,000)	1検体 (1時間以内)
	DART質量分析計 [DART-MS] (JMS-Q1000TD)	4,500 (9,000)	8,100 (13,500)	10,800 (18,000)	1検体 (1時間以内)
	X線構造解析装置 (※6) (SmartLab9kW/IP/HY/N)	11,500 (23,000)	20,700 (34,500)	27,600 (46,000)	1検体 (4時間以内)
	高性能単結晶X線自動解析装置 (XtalLAB Synergy-R/Cu)	31,700 (63,400)	57,100 (95,100)	76,100 (126,800)	1検体 (15時間以内)
	600MHz NMR (※7) (JNM-ECA600)	3,400 (6,800)	6,100 (10,200)	8,200 (13,600)	1検体 (0.5時間以内)
	500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	3,100 (6,200)	5,600 (9,300)	7,400 (12,400)	1検体 (0.5時間以内)
	400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	3,100 (6,200)	5,600 (9,300)	7,400 (12,400)	1検体 (0.5時間以内)
	電子スピン共鳴装置 [ESR] (JES-FA100N)	4,700 (9,400)	8,500 (14,100)	11,300 (18,800)	1検体 (4時間以内)
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 [XPS] (PHI 5000 VersaProbe II)	17,800 (35,600)	32,000 (53,400)	42,700 (71,200)	1検体 (8時間以内)
	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	7,100 (14,200)	12,800 (21,300)	17,000 (28,400)	1検体 (4時間以内)
	円二色性分散計 [CD] (J-820)	3,100 (6,200)	5,600 (9,300)	7,400 (12,400)	1検体 (3時間以内)
	ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	5,900 (11,800)	10,600 (17,700)	14,200 (23,600)	1検体 (6時間以内)

技術代行	分光エリブソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	5,400 (10,800)	9,700 (16,200)	13,000 (21,600)	1 検体 (2 時間以内)
	光ダイナミクス分光装置 (※10) (Mira 900) (KEC-160) (C10910-04)	37,600 (75,200)	67,700 (112,800)	90,200 (150,400)	1 検体 (8 時間以内)
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	8,400 (16,800)	15,100 (25,200)	20,200 (33,600)	1 検体 (4 時間以内)
	大気中光電子分光装置 (AC-3)	3,200 (6,400)	5,800 (9,600)	7,700 (12,800)	1 検体 (1 時間以内)
	分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	6,200 (12,400)	11,200 (18,600)	14,900 (24,800)	1 検体 (2 時間以内)
	微細形状測定装置 (ET200)	1,200 (2,400)	2,200 (3,600)	2,900 (4,800)	1 検体 (1 時間以内)
技術補助	技術補助講習 (※11)	10,000	10,000	10,000	1 講習 (4 時間以内)
	一般技術補助	10,000	10,000	10,000	1 時間
機器利用 (※11)	200kV透過電子顕微鏡 [200kV-TEM] (※1) (JEM-2200FS)	4,700 (9,400)	8,500 (14,100)	11,300 (18,800)	1 時間
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 [FE-SEM] (SU9000)	4,000 (8,000)	7,200 (12,000)	9,600 (16,000)	1 時間
	低真空分析走査電子顕微鏡 [SEM] (SU6600)	3,600 (7,200)	6,500 (10,800)	8,600 (14,400)	1 時間
	多機能分析走査電子顕微鏡 [SEM] (IT800 (SHL))	4,200 (8,400)	7,600 (12,600)	10,100 (16,800)	1 時間
	微小デバイス特性評価装置 [nanoEBAC] (※12) (NE4000)	7,900 (15,800)	14,200 (23,700)	19,000 (31,600)	1 時間
	表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置 [AFM] (NanoWizard ULTRA Speed2)	4,400 (8,800)	7,900 (13,200)	10,600 (17,600)	1 時間
	マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 [MALDI-TOFMS] (※13) (autoflex II)	2,400 (4,800)	4,300 (7,200)	5,800 (9,600)	1 時間
	DART質量分析計 [DART-MS] (JMS-Q1000TD)	2,400 (4,800)	4,300 (7,200)	5,800 (9,600)	1 時間
	500MHz NMR (※7、※8) (JNM-ECZ500R)	2,300 (4,600)	4,100 (6,900)	5,500 (9,200)	1 時間
	400MHz 固体・溶液NMR (※7、※8、※9) (JNM-ECX400P)	2,300 (4,600)	4,100 (6,900)	5,500 (9,200)	1 時間
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 [XPS] (PHI 5000 VersaProbe II)	2,000 (4,000)	3,600 (6,000)	4,800 (8,000)	1 時間
	顕微レーザーラマン分光光度計 (NRS-4100)	1,300 (2,600)	2,300 (3,900)	3,100 (5,200)	1 時間
	円二色性分散計 [CD] (J-820)	1,200 (2,400)	2,200 (3,600)	2,900 (4,800)	1 時間
	ダイナミック光散乱光度計 (DLS-6000)	1,200 (2,400)	2,200 (3,600)	2,900 (4,800)	1 時間
	分光エリブソメーター (UVISEL ER AGMS-NSD)	1,800 (3,600)	3,200 (5,400)	4,300 (7,200)	1 時間
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (DSC 7000X/STA 7200)	1,700 (3,400)	3,100 (5,100)	4,100 (6,800)	1 時間
	大気中光電子分光装置 (AC-3)	1,700 (3,400)	3,100 (5,100)	4,100 (6,800)	1 時間
	分光感度・内部量子効率測定装置 (CEP-2000RP)	1,800 (3,600)	3,200 (5,400)	4,300 (7,200)	1 時間
	微細形状測定装置 (ET200)	1,200 (2,400)	2,200 (3,600)	2,900 (4,800)	1 時間
	共同研究	無料	(※14)		1 件

- ・利用時間に装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含む。また、利用時間は原則として平日の9時から17時までの間とする。
- ・技術代行において1検体当たりの標準測定時間を超過する場合又は特別な観察若しくは分析に必要な処理を要する場合は、規定の利用料に加え、別途実費相当額を利用料として徴収することがある。
 - (※1) EELS、電子回折法及びクライオ電子顕微鏡法による測定はできない。
 - (※2) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。
 - (※3) GC利用の場合は、再現性確認のために2回にわたって測定を行うことから、1検体当たり2倍の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金
 - 本学のカラムを利用する場合は、1検体当たり別途1,500円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収するとともに、測定に時間を要するため1検体当たり3倍の利用料を徴収する。また、本学で移動相を用意する場合は、1検体当たり別途750円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として、LC条件提示が有る場合は1測定当たり別途4検体分、LC条件提示が無い場合は1測定当たり別途8検体分の利用料を徴収する。
 - (※5) CSI測定の場合は、装置の起動に係る料金として1測定当たり別途1検体分の利用料を徴収する。
 - 1測定当たりの測定時間は最大4時間（装置の立ち上げに係る時間としての1時間を含む。）とし、これを超える場合は、以降3時間ごとに1検体分の利用料を徴収する。また、オプションユニットを利用して測定した場合は、その測定の種類に応じ、条件調整に係る料金として、1測定当たり別途次の利用料を徴収する。
 - ①CuK α 1単色化用Ge(220)2結晶法の場合：1,500円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ②環境雰囲気ユニットを用いた測定の場合：1,500円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ③逆格子マップ測定の場合：15,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ④インプレーン測定の場合：7,500円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ⑤2DXRD測定の場合：7,500円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - ⑥昇温測定の場合：15,000円（消費税及び地方消費税を除く。）
 - (※7) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、利用者が用意する。
 - (※8) 1測定当たりの測定時間は、最大3時間とする。
 - (※9) 液体サンプルについては技術代行又は機器利用、固体サンプルについては技術代行のみ可能とする。
 - (※10) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体当たりの利用料とする。
 - 利用者が機器利用をする場合は、あらかじめ機器操作に関する講習として技術補助講習を受講することを基本とする。
 - (※11) なお、技術補助講習時に利用者の試料を用いて講習を行い、その講習時に得られたデータを利用する場合は、技術代行に係る料金として別途1検体分の利用料を徴収する。
 - (※12) 本学のプローブを利用する場合は、1プローブ当たり別途30,000円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収する。
 - (※13) 機器利用において、プレートについては利用者が持込み、サンプル等のプリパレーションについては利用者が用意した後に利用とすることを基本とする。なお、本学のプレートを利用し、サンプル等のプリパレーションを本学で用意する場合は、1測定当たり別途7,500円（消費税及び地方消費税を除く。）の利用料を徴収する。
 - (※14) 利用料は、第21条の規定に基づいてセンター長が別に定める取扱いに従って徴収する。